

Application/Control	No.
10/711 006	

10//11,996

Applicant(s)/Patent under Reexamination

CHEN ET AL.

Art Unit 2627

Examiner VAN T. PHAM

				ISSUE	CL	.AS	SIF	ICAT	ION			
	INTERNATIONAL CLASSIFICATION											
CLASS SUBCLASS						CI	AIMED		NON-CLAIMED			
369			47.32			11	В	7	/00			1
	CROS	S REFEREN	ICES						,			1
CLASS	SUBCLAS	SS (ONE SL	R BLOCK)					<i>'</i>			•	
369	53.31								1			1
									1			/
					1				1			1
	:	•							1			1
								/	1			1

Van T. Pham 11/28/2007 (Assistant Examiner)

(Legal Instruments Examiner)

WAYNE YOUNG

Total Claims Allowed: 14

ERVISORY PATENT EXAMINE (Primary Examiner)

O.G. Print Claim(s)

O.G. Print Fig. 4

\boxtimes												□СРА		□ T.D.		☐ R.1.47			
Final	Original		Final	Original		Final	Original		Final	Original		Final	Original		Final	Original		Final	Original
	1			31			61]		91			121			151			181
	2	:		32			62			92			122			152			182
	3	:		33			63			93			123			153			183
	4	1		34			64			94			124			154			184
	5	:		35			65			95			125			155			185
	6	:		36			66			96			126			156			186
	7	:		37			67			97			127			157			187
,	8			38			68			98			128			158			188
	9			39			69			99			129			159		-	189
	10	:		40			70			100			130			160			190
	11	1		41			71			101			131			161			191
	12	:		42			72	·		102			132			162			192
	13	1		43			73			103			133			163			193
	14	:		44			74			104			134			164			194
	15			45			75			105			135			165			195
	16	:		46			76			106			136			166			196
	17	:		47			77			107			137			167			197
L	18	± :		48			78			108			138			168			198
	19	:		49			79			109			139			169			199
	20	i		50			80			110			140			170			200
	21	:		51			81			111			141			171			201
	22	i		52			82			112			142			172			202
	23	:		53			83			113			143			173			203
	24			54			84			114			144			174			204
	25			55			85			115			145			175			205
	26	:		56			86			116	·		146			176			206
	27			57			87			117			147			177			207
	28			58	,		88			118	7		148			178			208
	29	:		59			89			119			149			179			209
	30			60			90			120			150	l		180			210